

# SH367103

# 3/4串锂电池Pack保护芯片

#### 1. 特件

- SEL管脚选择3/4串应用
- 电压检测功能:
  - 过充电保护电压V<sub>OV</sub>: 3.6V 4.35V (档位10mV) 过充电保护电压精度: ±25mV
  - 过充电保护解除电压V<sub>OVR</sub><sup>1</sup>: 3.1V 4.35V (档位10mV) 过充电保护解除电压精度: ±50mV
  - 过放电保护电压V<sub>UV</sub>: 2.0V 3.1V (档位100mV) 过放电保护电压精度: ±80mV
  - 过放电保护解除电压V<sub>UVR</sub><sup>2</sup>: 2.0V 3.7V (档位100mV) 过放电保护解除电压精度: ±100mV
- 放电过流检测功能:
  - 过流1保护电压V<sub>DOC1</sub>: 0.025V 0.35V (档位25mV) 过流1保护电压精度: ±10mV
  - 过流2保护电压V<sub>DOC2</sub>: 2 X V<sub>DOC1</sub> (档位50mV) 过流2保护电压精度: ±20mV
- 短路检测功能:
  - 短路保护电压V<sub>SC</sub>: 4.5 X V<sub>DOC1</sub> (档位112.5mV) 短路保护电压精度: ±45mV

- 温度检测功能:
  - 充电高温保护温度: 50°C 充电高温保护温度精度: ±4°C (Max.)
  - 充电低温保护温度: 0°C 充电低温保护温度精度: ±4°C (Max.)
  - 放电高温保护温度: 70°C 放电高温保护温度精度: ±4°C (Max.)
- 外接电容设置过放电保护延时、放电过流1保护延时以及 放电过流2保护延时
- 过充电保护延时、短路保护延时以及温度保护延时固定
- CTL管脚控制CHG/DSG管脚输出
- 工作电压范围: 3V 26V
- 工作温度范围: -40°C~85°C
- 集成N-MOSFET驱动
- 低功耗设计:
  - 正常工作功耗: 15μA (Max.)
  - 休眠模式功耗: 4uA (Max.)
- 封装形式: 16-pin TSSOP

注释1:过充电迟滞电压n (n = 1 - 4)的大小等于0V - 0.5V之间以10mV为间隔的某一选定值。 (过充电迟滞电压 = 过充电保护阈值电压 - 过充电保护解除电压)

**注释2:** 过放电迟滞电压n (n = 1 - 4)的大小等于0V - 0.7V之间以100mV为间隔的某一选定值。 (过放电迟滞电压 = 过放电保护解除电压 - 过放电保护阈值电压)

#### 2. 概述

SH367103内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的监控,保证Pack安全。此外,SH367103具备0V充电功能,提升Pack使用寿命。

SH367103具有两种工作模式:正常模式和休眠模式。当任意电芯处于低容量状态时,SH367103进入休眠模式来降低系统功耗。

1

SH367103适用于保护3/4串锂电池Pack (包括磷酸铁锂Pack), SEL管脚用于选择3/4串应用。

V2.2



## 3. 系统框图

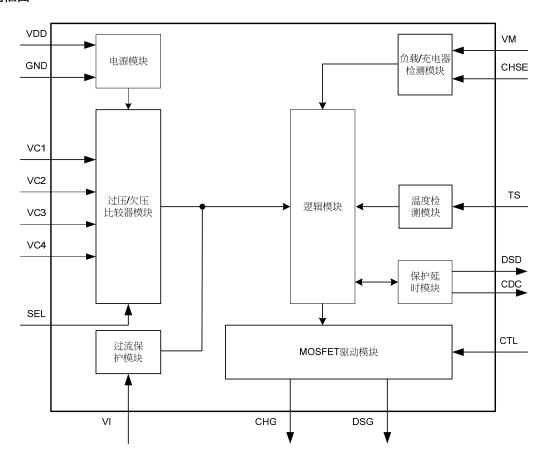


图1 SH367103系统框图



# 4. 管脚图

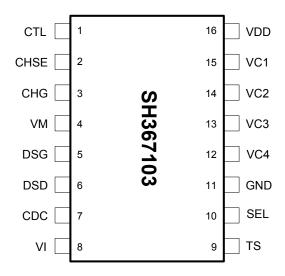


图2 SH367103管脚图



# 5. 管脚定义

管脚号	管脚名	I/O	功能描述
1	CTL	I	充放电MOSFET控制管脚
2	CHSE	I	充电器检测管脚
3	CHG	0	充电MOSFET控制管脚
4	VM	I	负载检测管脚
5	DSG	0	放电MOSFET控制管脚
6	DSD	I/O	过放电延时电容连接管脚
7	CDC	I/O	放电过流1/2延时电容连接管脚
8	VI	I	电流检测管脚
9	TS	I	温度电阻连接管脚
10	SEL	I	3/4节应用控制管脚
11	GND	I	电源地端连接管脚
12	VC4	I	最低电芯正端连接管脚
13	VC3	I	次低电芯正端连接管脚
14	VC2	ı	次高电芯正端连接管脚
15	VC1	I	最高电芯正端连接管脚
16	VDD	Ì	电源正端连接管脚

总计16个管脚。



#### 6. 功能描述

#### 6.1 正常模式

下列条件均满足时, SH367103 处于正常模式:

- (1) 所有电芯电压位于过充电保护电压 (Vov) 与过放电保护电压 (Vuv) 之间
- (2) VI管脚电平小于放电过流1保护电压VDOC1
- (3) TS管脚检测温度位于充电高温保护温度T<sub>COT</sub>与充电低温保护温度T<sub>CUT</sub>之间
- (4) 无安全保护发生

#### 6.2 过充电保护状态

下列条件均满足时,SH367103进入过充电保护状态:

- (1)任意电芯电压高于过充电保护电压Vov
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时tov

处于过充电保护状态时,CHG管脚输出高阻态。

下列条件均满足时,过充电保护状态解除:

- (1) 所有电芯电压低于过充电保护解除电压VovR
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护解除延时tovR

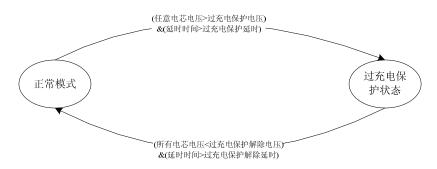


图3 过充电保护状态转移图

#### 6.3 过放电保护状态

下列条件均满足时,SH367103进入过放电保护状态:

- (1) 任意电芯电压低于过放电保护电压Vuv
- (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护延时tuv

处于过放电保护状态时,CHG输出高阻态(负载锁定时),DSG管脚输出低电平。

负载锁定解除后,下列条件均满足时,过放电保护状态解除:

- (1) 所有电芯电压高于过放电保护解除电压VuvR
- (2) (1)中状态持续时间超过过放电保护解除延时tuvR

注释3: 当下列条件满足其中之一时,负载锁定解除,退负载锁定延时64mS:

- (1) 拔除负载
- (2) 接充电器

注释4:特定型号的SH367103允许在负载连接时开启放电MOSFET,具体请咨询本公司销售人员。



#### 6.4 休眠模式

下列条件均满足时,SH367103进入休眠模式:

- (1) 过放电状态持续时间超过休眠延时tuvp (30S Typ.)
- (2) 未连接充电器 (未连接充电器判断条件: V<sub>CHSEL</sub> < CHSE管脚电平 < V<sub>CHSEH</sub>)

注释5:过放电保护后,当过放电保护状态持续时间超过30S,此时SH367103开启CHSE内部电阻上拉到VDD来判断充电器是否连接。

处于休眠模式,SH367103关闭系统大部分模块,停止电压/温度/电流检测。CHG管脚输出高阻态,DSG管脚输出低电平。

下列条件满足时,SH367103退出休眠模式:

(1) 连接充电器 (连接充电器判断条件: CHSE管脚电平 ≦ V<sub>CHSEL</sub>或CHSE管脚电平 ≧ V<sub>CHSEL</sub>)

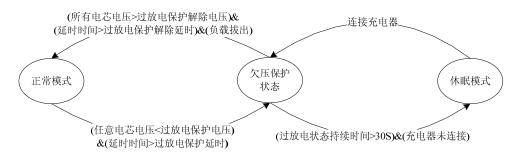


图4 过放电保护状态转移图

#### 6.5 放电过流保护状态

SH367103内置两级放电过流保护,过流1保护电压 $V_{DOC1}$ 小于过流2保护电压 $V_{DOC2}$ ,过流1保护延时 $T_{DOC1}$ 大于过流2保护延时 $T_{DOC2}$ 。

下列条件均满足时,SH367103进入过流保护状态:

- (1) VI管脚电压高于过流1保护电压VDOC1 (过流2保护电压VDOC2)
- (2) (1)中状态持续时间超过过流1保护延时t<sub>DOC1</sub> (过流2保护延时t<sub>DOC2</sub>)

处于过流保护状态时, CHG输出高阻态, DSG管脚输出低电平。

下列条件均满足时,过流保护状态解除:

- (1) 负载拔出 (负载拔出判断条件: VM管脚电平低于V<sub>VM</sub>)
- (2) (1)中状态持续时间超过过流保护解除延时t<sub>DOCR</sub>

注释6: 过流保护后,此时SH367103开启VM内部电阻下拉到GND来判断负载是否拔出。

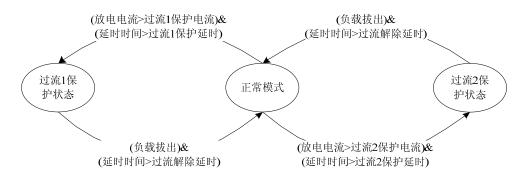


图5 过流保护状态转移图



#### 6.6 短路保护状态

下列条件均满足时,SH367103进入短路保护状态:

- (1) VI管脚电压高于短路保护电压Vsc
- (2) (1)中状态持续时间超过短路保护延时tsc

处于短路保护状态时,CHG输出高阻态,DSG管脚输出低电平。

下列条件均满足时,短路保护状态解除:

- (1) 负载拔出 (负载拔出判断条件: VM管脚电平低于V<sub>VM</sub>)
- (2) (1)中状态持续时间超过短路保护解除延时tscR

注释7: 短路保护后,此时SH367103开启VM内部电阻下拉到GND来判断负载是否拔出。

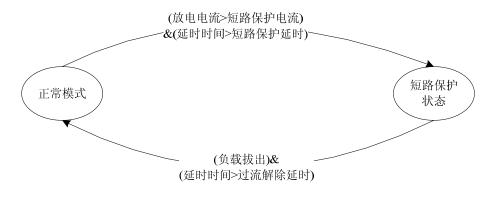


图6 短路保护状态转移图

### 6.7 温度保护

当TS管脚外接温度电阻 (温度电阻采用NTC,建议使用103AT) 时,SH367103能进行温度保护,包括:充电高温保护、充电低温保护以及放电高温保护。

当温度电阻使用103AT (β = 3435) 时,温度保护规则如下:

#### 6.7.1 充电高温保护状态

下列条件均满足时,SH367103进入充电高温保护状态:

(1) 温度高于充电高温保护温度Tcot

处于充电高温保护状态时,如果检测为充电状态,则CHG管脚输出高阻态。

下列条件均满足时, 充电高温保护状态解除:

(1) 温度低于充电高温保护恢复温度T<sub>COTR</sub>

#### 6.7.2 充电低温保护状态

下列条件均满足时,SH367103进入充电低温保护状态:

(1) 温度低于充电低温保护温度T<sub>CUT</sub>

处于充电低温保护状态时,如果检测为充电状态,则CHG管脚输出高阻态。

下列条件均满足时, 充电低温保护状态解除:

(1) 温度高于充电低温保护恢复温度Tcutr

### 6.7.3 放电高温保护状态

下列条件均满足时,SH367103进入放电高温保护状态:

(1) 温度高于放电高温保护温度TDOT

处于放电高温保护状态时,CHG管脚输出高阻态,DSG管脚输出低电平。

下列条件均满足时,放电高温保护状态解除:

(1) 温度低于放电高温保护恢复温度TDOTR



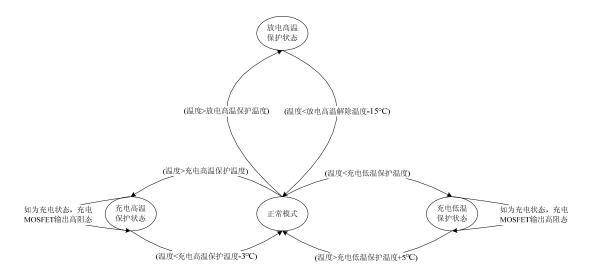


图7温度保护状态转移图

注释8:温度检测为分时检测,检测周期为2S,连续检测2次。

SH367103推荐使用的温度电阻103AT (β = 3435), 其在不同温度下对应的阻值如下表所示:

温度点 (°C)	103AT电阻值 (KΩ)	电阻值变异范围 ( <b>K</b> Ω)
-20	67.77	72.72 - 63.20
-15	53.41	57.11 - 49.98
-10	42.47	45.27 - 39.86
-5	33.90	36.02 - 31.92
0	27.28	28.90 - 25.76
5	22.05	23.29 - 20.88
25	10	9.700 - 10.30
45	4.911	5.094 - 4.735
47	4.554	4.691 - 4.417
50	4.16	4.306 - 4.018
55	3.536	3.654 - 3.421
60	3.02	3.115 - 2.927
65	2.588	2.665 - 2.513
70	2.228	2.291 - 2.167

表1 103AT (β = 3435) 电阻值与温度关系表

### 6.8 充放电状态判定

SH367103由VI管脚电平判断系统充放电状态。当VI管脚电平高于放电状态检测电压V<sub>DCH</sub>,则判定系统处于放电状态,除放电状态外,系统处于充电状态。SH367103判定充放电状态切换的延时时间为t<sub>STATUS</sub>。

## 6.9 0V充电功能

Pack 电压不小于 1.5V,当充电器电压大于  $V_{0CHA}$  时,SH367103 允许充电器给 Pack 充电。若充电 MOSFET 开启阈值电压不同,充电器最低需求电压不同。



## 7. 功能设定

### 7.1 CTL管脚设定

SH367103中,CTL管脚控制CHG/DSG管脚的输出。具体操作方法如下表所示:

CTL管脚	CHG管脚	DSG管脚
V <sub>DD</sub> 电平	取决于内部保护电路	取决于内部保护电路
悬空	高阻态	GND
GND电平	高阻态	GND

## 7.2 SEL管脚设定

SH367103中, SEL管脚用于配置3/4串应用, 具体操作方法如下表所示:

SEL	芯片功能
GND电平	3节电芯保护
V <sub>DD</sub> 电平	4节电芯保护

SH367103用于3串Pack保护时,VC4与GND短接即可。

## 7.3 延时时间设定

SH367103中,可设置部分保护延时及保护解除延时。延时时间设定的细节如下表所示:

内容	标号	关联设置	计算方法
过充电保护延时	t <sub>OV</sub>	芯片内部固定	18
过充电保护解除延时	t <sub>OVR</sub>	芯片内部固定	1mS
过放电保护延时	t <sub>UV</sub>	DSD管脚外接电容C <sub>DSD</sub>	1S X C <sub>DSD</sub> /0.1uF
过放电保护解除延时	t <sub>UVR</sub>	DSD管脚外接电容C <sub>DSD</sub>	100mS X C <sub>DSD</sub> /0.1uF
过流1保护延时	t <sub>DOC1</sub>	CDC管脚外接电容CcDC	1S X C <sub>CDC</sub> /0.1uF
过流2保护延时	t <sub>DOC2</sub>	CDC管脚外接电容CcDC	0.1S X C <sub>CDC</sub> /0.1uF
过流保护解除延时	$t_{DOCR}$	CDC管脚外接电容CcDC	1S×C <sub>CDC</sub> /0.1uF 或 0.1S×C <sub>CDC</sub> /0.1uF
短路保护延时	$t_{SC}$	芯片内部固定	250uS
短路保护解除延时	$t_{SCR}$	CDC管脚外接电容CcDC	1S×C <sub>CDC</sub> /0.1uF 或 0.1S×C <sub>CDC</sub> /0.1uF
温度保护延时	t <sub>T</sub>	芯片内部固定	3S
温度保护退出延时	t <sub>TR</sub>	芯片内部固定	3S
休眠模式延时	t <sub>UVP</sub>	芯片内部固定	30\$
充放电状态切换延时	t <sub>STATUS</sub>	芯片内部固定	500mS



## 8. 典型应用图

## 8.1 4串同口应用

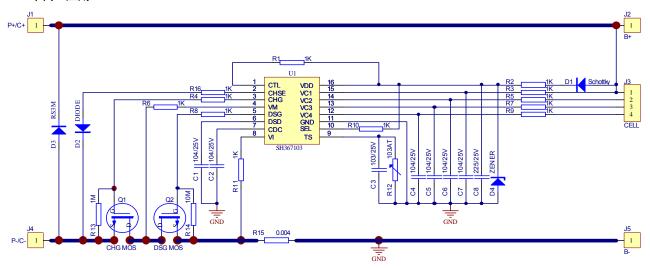


图8 SH367103典型应用图 (4串同口)

## 8.2 4串半分口应用

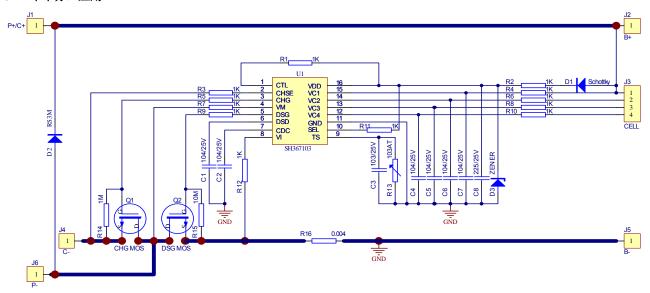


图9 SH367103典型应用图 (4串半分口)



#### 8.3 3串同口应用

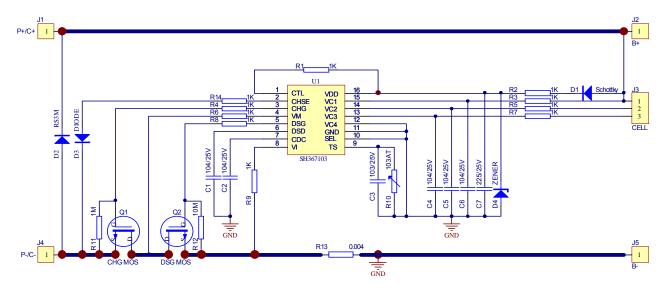


图10 SH367103典型应用图 (3串同口)

## 8.4 4串-PMOSFET充电应用

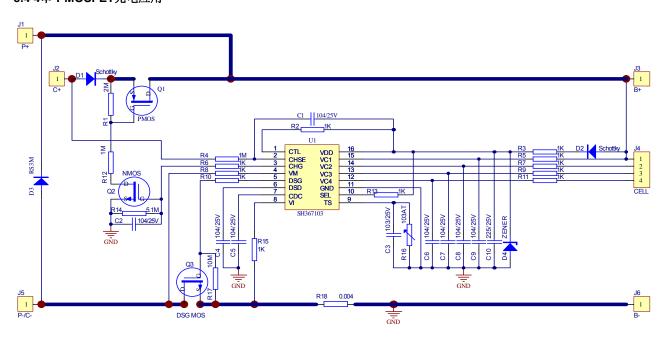


图11 SH367103典型应用图 (4串-PMOSFET充电)



## 8.5 功耗测试附图

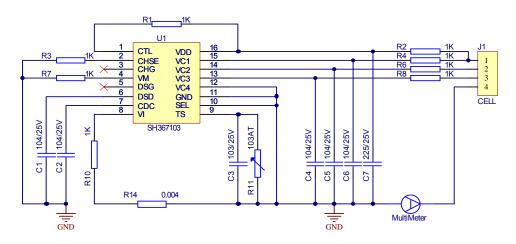


图12 芯片功耗测试应用电路图



## 9. 电气特性

## 9.1 极限参数

信号名	管脚名	极限范围	单位
VDD和GND间输入电压	VDD	GND-0.3 to GND+26	V
高压输入端	DSG/VC1 - VC4/CTL/SEL	GND-0.3 to V <sub>DD</sub> +0.3	V
同压制八吨	VM/CHG/CHSE	V <sub>DD</sub> -26 to V <sub>DD</sub> +0.3	V
低压输入端	VI/CDC/DSD/TS	GND-0.3 to 5.5	V
工作温度	-	-40 to 85	°C
存储温度	-	-40 to 125	°C

**注释9**:如果器件的工作条件超过"极限参数"的范围,将造成器件永久性破坏。器件工作在说明书所规定的范围内功能 才能得到保障。

*注释10:* -0.3V < (VC<sub>N</sub>-VC<sub>N-1</sub>) < 12V

## 9.2 直流电气特性 (无特别说明,电气特性在25°C下测得)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$V_{OV}$	过充电保护电压	3.6	-	4.35	V	
$V_{\text{OVA}}$	过充电保护电压精度	-25	-	25	mV	
Vovs	过充电保护电压Step	-	10	-	mV	
$V_{OVR}$	过充电保护解除电压	3.1	-	4.35	V	
V <sub>OVRA</sub>	过充电保护解除电压精度	-50	-	50	mV	
$V_{\text{OVRS}}$	过充电保护解除电压Step	-	10	-	mV	
t <sub>OV</sub>	过充电保护延时	0.5	1	1.5	S	
t <sub>OVR</sub>	过充电保护解除延时	0.5	1	1.5	mS	
$V_{UV}$	过放电保护电压	2.0	-	3.1	V	档位: 100mV
$V_{\text{UVA}}$	过放电保护电压精度	-80	-	80	mV	
V <sub>UVS</sub>	过放电保护电压Step	-	100	-	mV	
V <sub>UVR</sub>	过放电保护解除电压	2.0	-	3.7	V	
$V_{\text{UVRA}}$	过放电保护解除电压精度	-100	-	100	mV	
V <sub>UVRS</sub>	过放电保护解除电压Step	-	100	-	mV	
tuv	过放电保护延时	0.5	1	1.5	S	DSD管脚外接0.1μF电容,精度±10%
t <sub>UVR</sub>	过放电保护解除延时	50	100	150	mS	DSD管脚外接0.1μF电容,精度±10%
V <sub>DOC1</sub>	过流1保护电压	0.025	-	0.35	V	
$V_{\text{DOC1A}}$	过流1保护电压精度	-10	-	10	mV	
$V_{\text{DOC1S}}$	过流1保护电压Step	-	25	-	mV	
t <sub>DOC1</sub>	过流1保护延时	0.5	1	1.5	S	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
$V_{\text{DOC2}}$	过流2保护电压	-	2*V <sub>DOC1</sub>	-	V	
$V_{\text{DOC2A}}$	过流2保护电压精度	-20	-	20	mV	
V <sub>DOC2S</sub>	过流2保护电压Step	-	2*V <sub>DOC1S</sub>	-	mV	
t <sub>DOC2</sub>	过流2保护延时	50	100	150	mS	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
V <sub>SC</sub>	短路保护电压	-	4.5*V <sub>DOC1</sub>	-	V	
V <sub>SCA</sub>	短路保护电压精度	-45	-	45	mV	
V <sub>SCS</sub>	短路保护电压Step	-	4.5* VDOC1S	-	mV	



# (续上表)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
tsc	短路保护延时	200	250	300	uS	V <sub>DD</sub> = 14V, VI >= V <sub>SC</sub> + 100mV
4	过流保护解除延时 <sup>11</sup>	0.5	1	1.5	S	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
t <sub>DOCR</sub>	过机床扩展陈延的	50	100	150	mS	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
t	短路保护解除延时 <sup>11</sup>	0.5	1	1.5	S	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
<b>t</b> <sub>SCR</sub>	<b>应的床扩</b> 解床延的	50	100	150	mS	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
T <sub>COT</sub>	充电高温保护温度	46	50	54	°C	
$T_{\text{COTR}}$	充电高温保护恢复温度	43	47	51	°C	
$T_DOT$	放电高温保护温度	66	70	74	°C	
$T_{DOTR}$	放电高温保护恢复温度	51	55	59	ç	
$T_CUT$	充电低温保护温度	-4	0	4	°C	
$T_{\text{CUTR}}$	充电低温保护恢复温度	1	5	9	ç	
$t_{T}$	温度保护检测延时	1.5	3	5.5	S	
$t_{TR}$	温度保护解除检测延时	1.5	3	5.5	S	
$V_{\text{DCH}}$	放电状态判断电压	2.5	4	5.5	mV	
$V_{\text{DD}}$	工作电压	3	-	26	>	CHG和DSG管脚能够保持正确的输出状态
I <sub>CC</sub>	工作电流 (正常模式)	-	-	15	μΑ	V1=V2=V3=V4 =V <sub>OV</sub> -50mV,V <sub>DD</sub> =VC1, 在芯片接地处测量
I <sub>IDLE</sub>	工作电流 (休眠模式)	-	-	4	μΑ	V1=V2=V3=V4=3V, V <sub>DD</sub> =12V, 在芯片接地处测量
t <sub>UVP</sub>	休眠延时	20	30	40	S	
V <sub>0CHA</sub>	最低充电器电压	-	1	1.5	V	
t <sub>STATUS</sub>	充放电状态切换延时	200	500	650	mS	
R <sub>CHSE</sub>	CHSE管脚内部上拉电阻	800	1300	1800	ΚΩ	
$R_{\text{VM}}$	VM管脚内部下拉电阻	250	500	750	ΚΩ	
$V_{\text{CTLH}}$	逻辑高电平电压	0.8*V <sub>DD</sub>	-	-	V	
V <sub>CTLL</sub>	逻辑低电平电压	-	-	0.2*V <sub>DD</sub>	V	
$V_{SELH}$	逻辑高电平电压	V <sub>DD</sub> -0.6	-	-	V	
V <sub>SELL</sub>	逻辑低电平电压	-	-	0.6	V	
I <sub>VC1</sub>	V <sub>C1</sub> 管脚消耗电流	-	1.5	3	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
I <sub>VC2</sub>	V <sub>C2</sub> 管脚消耗电流	-1		1	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
I <sub>VC3</sub>	V <sub>C3</sub> 管脚消耗电流	-1		1	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
$I_{VC4}$	V <sub>C4</sub> 管脚消耗电流	-1		1	μA	V1=V2=V3=V4=4.35V
I <sub>CTLH</sub>	CTL管脚高电平消耗电流	-	0.2	0.4	μA	V1=V2=V3=V4=3.8V, V <sub>CTL</sub> =V <sub>DD</sub>
I <sub>CTLL</sub>	CTL管脚低电平消耗电流	-0.1	-	-	μA	V1=V2=V3=V4=3.8V, V <sub>CTL</sub> =GND
$V_{DSG}$	DSG管脚高电平输出	-	$V_{DD}$	-	V	DSG接10nF电容
V <sub>CHG-1</sub>	CHG管脚高电平输出	9	11	12	V	V <sub>DD</sub> >=11V,CHG接1M电阻
V <sub>CHG-2</sub>	CHG管脚高电平输出	V <sub>DD</sub> -0.5	V <sub>DD</sub> -0.1	-	V	V <sub>DD</sub> <11V,CHG接1M电阻
$V_{\text{CHSEL}}$	CHSE管脚电平1	0.6	1	1.5	V	检测充电器
V <sub>CHSEH</sub>	CHSE管脚电平2	V <sub>DD</sub> +0.05	V <sub>DD</sub> +0.1	V <sub>DD</sub> +0.2	V	检测充电器
$V_{VM}$	VM管脚电平	1.05	1.2	1.35	V	检测负载



# 9.3 直流电气特性 (电气特性在-40℃~85℃范围内测得)

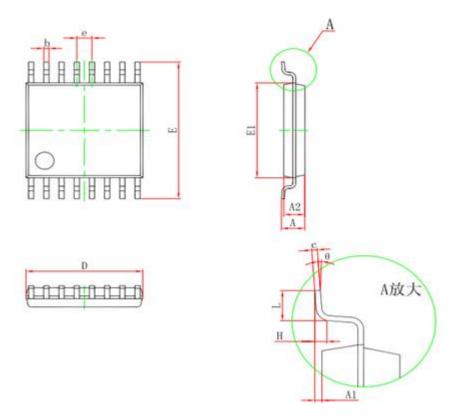
符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
T <sub>COV</sub>	过充电保护电压温度系数	-1	0	1	mV/°C	
T <sub>COVR</sub>	过充电保护解除电压温度系数	-1	0	1	mV/°C	
t <sub>OV</sub>	过充电保护延时	0.5	1	1.5	S	
t <sub>OVR</sub>	过充电保护解除延时	0.5	1	1.5	mS	
T <sub>CUV</sub>	过放电保护电压温度系数	-1	0	1	mV/°C	
T <sub>CUVR</sub>	过放电保护解除电压温度系数	-1	0	1	mV/°C	
t <sub>UV</sub>	过放电保护延时	0.45	1	1.55	S	DSD管脚外接0.1μF电容,精度±10%
t <sub>OVR</sub>	过放电保护解除延时	45	100	155	mS	DSD管脚外接0.1μF电容,精度±10%
$V_{\text{DOC1A}}$	过流1保护电压精度	-10	-	10	mV	
t <sub>DOC1</sub>	过流1保护延时	0.45	1	1.55	S	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
t <sub>DOC2</sub>	过流2保护延时	45	100	155	mS	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
t <sub>SC</sub>	短路保护延时	150	250	350	uS	$V_{DD}$ =14V, $VI>=V_{SC}+100mV$
tocan	过流保护解除延时 <sup>11</sup>	0.45	1	1.55	S	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
t <sub>DOCR</sub>	过机体扩展 地口	45	100	155	mS	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
toon	短路保护解除延时 <sup>11</sup>	0.45	1	1.55	S	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
t <sub>SCR</sub>	应时 休 7	45	100	155	mS	CDC管脚外接0.1µF电容,精度±10%
T <sub>COT</sub>	充电高温保护温度	46	50	54	°C	
$T_{COTR}$	充电高温保护恢复温度	41	45	49	°C	
$T_DOT$	放电高温保护温度	66	70	74	°C	
$T_DOT$	放电高温保护恢复温度	51	55	59	°C	
T <sub>CUT</sub>	充电低温保护温度	-4	0	4	°C	
$T_{\text{CUTR}}$	充电低温保护恢复温度	1	5	9	°C	
t⊤	温度保护延时	1.5	3	5.5	S	
t <sub>TR</sub>	温度保护解除延时	1.5	3	5.5	S	
$V_{DCH}$	放电状态判断电压	2.5	4	5.5	mV	
I <sub>CC</sub>	工作电流 (正常模式)	-	-	15	μΑ	V1=V2=V3=V4=V <sub>OV</sub> -50mV,V <sub>DD</sub> =VC1,在 芯片接地处测量; (参考 <u>12 功耗测试附图</u> )
I <sub>IDLE</sub>	工作电流 (休眠模式)	-	-	4	μA	V1=V2=V3=V4=3V,V <sub>DD</sub> =15V,在芯片接地 处测量; (参考 <u>12 功耗测试附图</u> )
t <sub>STATUS</sub>	充放电状态切换延时	200	500	650	mS	
I <sub>VC1</sub>	V <sub>C1</sub> 管脚消耗电流	-	1.5	3	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
I <sub>VC2</sub>	V <sub>C2</sub> 管脚消耗电流	-1	-	1	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
I <sub>VC3</sub>	V <sub>C3</sub> 管脚消耗电流	-1	-	1	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
I <sub>VC4</sub>	V <sub>C4</sub> 管脚消耗电流	-1	-	1	μΑ	V1=V2=V3=V4=4.35V
$V_{DSG}$	DSG管脚高电平输出	-	$V_{DD}$	-	V	DSG接10nF电容
V <sub>CHG-1</sub>	CHG管脚高电平输出	9	11	13	V	V <sub>DD</sub> >=11V,CHG接1M电阻
$V_{\text{CHG-2}}$	CHG管脚高电平输出	V <sub>DD</sub> -2	V <sub>DD</sub> -1	-	V	V <sub>DD</sub> <11V,CHG接1M电阻
$V_{\text{CHSEL}}$	CHSE管脚电平1	0.6	1	2	V	检测充电器
$V_{\text{CHSEH}}$	CHSE管脚电平2	V <sub>DD</sub> +0.05	V <sub>DD</sub> +0.15	V <sub>DD</sub> +0.2	V	检测充电器
$V_{\text{VM}}$	VM管脚电平	1.05	1.2	1.35	V	检测负载

注释11: 放电过流退出时间由芯片内部配置。



10. 封装信息

**TSSOP16L** 外观尺寸 单位: inches/mm



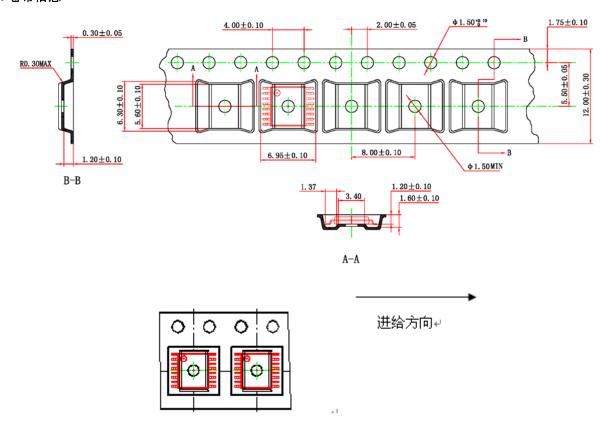
标号	尺寸(	毫米)	尺寸(英寸)		
100 J	最小值	最大值	最小值	最大值	
D	4.900	5.100	0.193	0.201	
Е	6.250	6.550	0.246	0.258	
b	0.190	0.300	0.007	0.012	
С	0.090	0.200	0.004	0.008	
E1	4.300	4.500	0.169	0.177	
Α		1.200		0.047	
A2	0.800	1.000	0.031	0.039	
A1	0.050	0.150	0.002	0.006	
е	0.65(	BSC)	0.026(BSC)		
L	0.500	0.700	0.020	0.028	
Н	0.25(	TYP)	0.01(TYP)		
θ	1°	7°	1°	7°	

### 注意:

- (1) 封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺。
- (2) 如无特殊规定,容差为±0.1毫米。
- (3) 共面性: 0.1毫米。
- (4) 控制尺寸为毫米。对转换成的英寸不做要求。

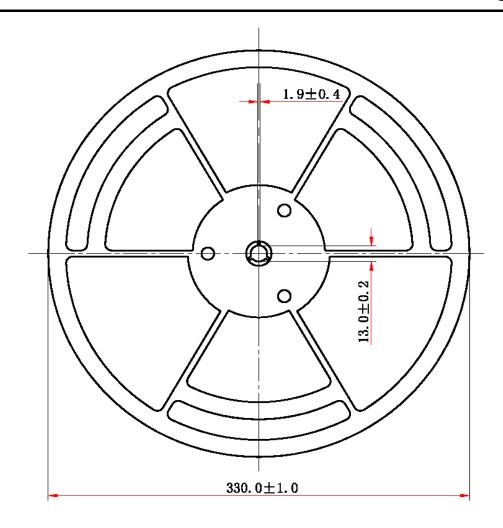


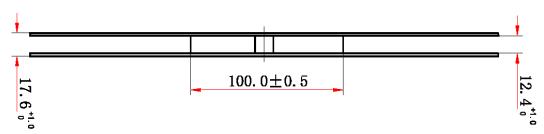
## 11. 卷带信息



- (1) 黑色导电型,配备热熔性盖带,宽度为 (9.20±0.10) 毫米,厚度为 (0.10±0.01) 毫米,且透明导电。
- (2) 口袋底的额定表面电阻系数为 $10^5\Omega/\Box\sim10^{11}\Omega/\Box$ 。
- (3) 载带直线弯曲度: ≤1毫米/100毫米。
- (4) 10个传送定位孔间距累积公差0.20MAX。
- (5) 所有尺寸为毫米,未注公差为0.025毫米。
- (6) 视图方向: □ •。







- (1) 每盘装产品3000只。
- (2) 该卷盘必须满足载带、编带要求。
- (3) 卷盘颜色为蓝色。
- (4) 所有尺寸为毫米。 (5) 视图方向: □ •。



## 12. 订购信息

型号	过充电 检测电 压(V)	过充电 解除电压 (V)	过放电 检测电 压(V)	过放电 解除电压 (V)	过流1 检测电压 (V)	过流2 检测电压 (V)	短路检 测电压 (V)				负 <b>载</b> 锁定	放电过流退 出时间/放电 过流1进入时 间
SH367103X/ 016XY-AAB00	4.20	4.10	2.5	3.00	0.10	0.20	0.45	0	50	70	有	1/1
SH367103X/ 016XY-AAE00	4.25	4.15	2.7	3.00	0.10	0.20	0.45	0	50	70	有	1/10
SH367103X/ 016XY-AAF00	4.20	4.10	2.5	3.00	0.10	0.20	0.45	0	50	70	有	1/10
SH367103X/ 016XY-BAA00	3.9	3.9	2	2.3	0.1	0.2	0.45	0	50	70	无	1/10
SH367103X/ 016XY-BAB00	3.9	3.6	2.2	2.7	0.1	0.2	0.45	0	50	70	有	1/10

注释12:支持"负载锁定":当系统退出过放电保护状态后,如果负载未拔出则不开启放电MOSFET;如果负载拔出则开启放电MOSFET。不支持"负载锁定":当系统退出过放电保护状态后,无论负载是否拔出,都开启放电MOSFET。 注释13:要了解更多SH367103型号,请咨询本公司业务部。



# 13. 产品规格更改记录

版本	记录	日期
2.2	修改应用原理图SENSE电阻阻值	2015年12月
2.1	修改应用原理图,修改放电过流退出延时	2015年12月
2.0	修改各应用原理图	2015年8月
1.0	初始版本	2015年5月



目录	ŧ	
1.	特性	
2.	概述	
3.	系统框图	2
4.	管脚图	
5.		
	り能描述	
0. 73	6.1 正常模式	
	6.2 过充电保护状态	
	6.3 过放电保护状态	5
	6.4 休眠模式	6
	6.5 放电过流保护状态	
	6.6 短路保护状态	
	6.7 温度保护	
	6.7.1 充电高温保护状态	
	6.7.2 充电低温保护状态	
	6.7.3 放电高温保护状态	
	6.8 充放电状态判定	
<b>-</b> !	6.9 0V充电功能	
7. 切	力能设定	
	7.1 CTL管脚设定 7.2 SEL管脚设定	
	7.2 SEL目脚反足	
o ##	中型应用图	
0. 典	· 圣应用图	
	8.2 4串半分口应用	
	8.3 3串同口应用	
	8.4 4串-PMOSFET充电应用	
	8.5 功耗测试附图	
a曲	<b>3</b> 气特性	
JE	9.1 极限参数	
	9.2 直流电气特性 (无特别说明,电气特性在25 ℃下测得)	
	9.3 直流电气特性 (电气特性在-40 ℃~85 ℃范围内测得)	
10. ‡	封装信息	
	表帯信息	
	订购信息	
	产品规格更改记录	